

平成 29 年 7 月 12 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 154 回研究会 開催通知

日時： 2017 年 8 月 29 日 (火) 13:00 ~ 17:30
会場： 明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン A4 会議室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「X 線を用いた先端材料評価技術
-ウェーハ評価からナノスケールイメージングまで-

世話人：志村考功 (大阪大学)、廣沢一郎 (高輝度光科学研究センター)、表 和彦 (リガク)

プログラム

13:00~13:05	開会の挨拶	明治大学 田島道夫
13:05~13:10	はじめに	大阪大学 志村考功
13:10~13:50	「多波回折条件下における X 線明視野トポグラフィ」	兵庫県立大学 松井純爾
13:50~14:30	「最新実験室トポグラフによる結晶転位の 3 次元観測」	(株)リガク 表 和彦
14:30~15:10	「放射光を用いた有機薄膜の形成過程及びデバイス動作過程のその場観察」	高輝度光科学研究センター 渡辺 剛
15:10~15:25	休憩	
15:25~16:05	「GeSn/Ge 微細構造を用いた局所歪構造の作製とその分析」	名古屋大学 中塚 理
16:05~16:45	「放射光マイクロビーム X 線による InGaN 系材料の評価」	日亜化学工業 (株) 榊 篤史
16:45~17:25	「高分解能かつ色収差のない X 線顕微鏡の開発」	大阪大学 松山智至
17:25~17:30	おわりに	大阪大学 志村考功
17:40~19:40	意見交換会(明治大学駿河台キャンパス リバティータワー23 階宮城浩蔵ホール)	以上